

△の数	訂	正	記	事	担当	検図	年月日	△の数	訂	正	記	事	担当	検図	年月日	
△	2			RE-F-09653	中村	山口	04.04.06	△								
△	1			RE-F-10251	土井	▲沢	05.02.02	△								
適用規格																
定 格	使用温度範囲		-55℃～85℃				保存温度範囲		-10℃～60℃(注3)							
	電 圧		AC 100 V				使用湿度範囲		40%～80%							
	電 流		0.4 A				保存湿度範囲		40%～70%(注3)							
性 能																
	項 目		試 験 方 法				規 格				QT	AT				
構 造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○				
	表示		目視にて確認する。								○	○				
電 気 的 性 能	接触抵抗		100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。				80 mΩ以下(注1)				○	—				
	低電圧、低電流下の接触抵抗		20 mV以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で測定する。				100 mΩ以下(注2)				○	—				
	絶縁抵抗		DC 250 Vで測定する。				100 MΩ以上				○	—				
	耐電圧		AC 300 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				○	—				
機 械 的 性 能	繰り返し動作		50 回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 100 mΩ以下(注2) ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—				
	耐振性		周波数 10～55 Hz、振幅 1.5 mm、 3 方向各 2 時間試験する。				① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 100 mΩ以下(注2)				○	—				
	耐衝撃性		加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3方向各 3 回試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—				
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性		温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。				① 接触抵抗: 100 mΩ以下(注2) ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上				○	—				
	温度サイクル		温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→2→3→30→2→3 分 を 5 サイクル試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—				
	塩水噴霧		濃度 5% の塩水、48 時間放置する。				① 接触抵抗: 100 mΩ以下(注2)				○	—				
	硫化水素		濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)				② はなはだしい腐食がないこと。				○	—				
	はんだ耐熱性		リフローの場合: ピーク温度 MAX250℃ 220℃以上 60秒以内 はんだごての場合: こて温度 360℃▲ はんだ付け時間 5 秒以内				外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。				○	—				
	はんだ付け性		▲ ▲ はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 3 秒間のはんだ付けを行う。				はんだ浸せき面の 95%以上が 新しいはんだでぬれていること。				○	—				
備考																
注1. 本製品のスタッキング高さ10mmタイプでの導体抵抗を考慮し、接触抵抗の初期値を80mΩとする。							製 図		担 当		検 図		承 認		出 図	
注2. 試験後、初期値からの変化量が20mΩ以下のこと。							HIF 03.01.17 鈴木		HIF 03.01.24 中村		HIF 03.01.24 大川		IC 03.01.24 吉村			
注3. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。																
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。																
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目																
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.							製品規格表				製品名 FX8C-※※P-SV2(93)					
旧CL CL			図番 SLC4-151088-23			製品コード CL578			1 1							

